

# 日本TOPCON拓普康近红外分光辐射计SR-NIR

产品名称	日本TOPCON拓普康近红外分光辐射计SR-NIR
公司名称	苏州加茂藤工业品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:TOPCON拓普康 型号:SR-NIR 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区东吴北路98号2217室（注册地址）
联系电话	13646204128

## 产品详情

### 产品概要

近年来，在显示器及照明市场上，对“近红外领域”的测定需求日渐增多。

之前，行业内并没有一款能够简便且高精度测定近红外光的相关仪器。

TOPCON在通过开发生产SR系列分光辐射度计所培育并积累起来的技术基础之上，

开发出了“SR-NIR近红外分光辐射度计”。

本产品和其他型号的SR系列分光辐射度计一并使用，能够测定380nm-1030nm的分光辐射亮度。

### 特征

能测定从FPD到微弱发光的近红外领域。

高精度测定近红外领域(600 ~ 1030nm)的分光分布。

和本公司其他型号的分光辐射度计一并使用时，能够测定可见光 ~ 近红外光（380 ~ 1030nm）的分光分布。

### 主要用途

观察各类FPD的近红外领域的输出。

观察Ne、Ar的光谱线输出。

光学膜等的近红外透过特性评价。

其他光源的近红外分光测量

技术规格光亮采集电子冷却型线性阵列传感器波长分散原理衍射光栅光学系统对物镜：f= 82mm F2.5, 目镜：观测视野 5° 测定角 2° / 1° / 0.2° / 0.1° (电动切换式) 最小测定直径(mm) 2° : 10.0, 1° : 4.99, 0.2° : 1.00, 0.1° : 0.50 (mm) 测定距离 350mm - (从物镜金属件前端开始的距离) 测定波长范围 600 - 1030nm 光谱波宽 6 - 8nm (半波宽) 波长分解能力 1nm 测定模式 自动/手动 (积分时间/频率)、外部垂直同步信号输入 测定内容 分光辐射亮度：Wsr-1m-2nm-1 测定范围(\*1)

2.0° : 0.5 - 3,000 cd/m<sup>2</sup>

1.0° : 1 - 9,000 cd/m<sup>2</sup>

0.2° : 20 - 70,000 cd/m<sup>2</sup>

0.1° : 100 - 300,000 cd/m<sup>2</sup>

重复精度(\*2) ± 2% 以下 偏光特性 分光辐射亮度 5%

以下校正基准 本公司校正基准\*标准A光源、23 ± 3 °C、65% RH 以下 测定时间(\*3) 约 1 - 31 秒 界面 RS-232C, USB 2.0 电源专用 AC 电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz, 功率约 34W 使用条件 温度: 5 - 35 °C, 湿度: 80%RH 以下 (且无凝露) 外形尺寸(W × D × H) 150 × 406 × 239mm 质量约 5.5kg

\*1 本产品不测定亮度。记录针对标准A光源的参考值

\*2 600 ~ 1030nm 针对本公司基准光源

\*3 E和PC的通信时间除外

测定直径

测定直径: mm

测定角 测定距离 [mm] \*350

500

800 1000 2000 2° 10.0 15.125 432.266 41° 4.997 5512.716 133.20 2° 1.001 512.543 226.640 1° 0.500 761.271 613.32

\* 从物镜金属件前端开始的距离